

# EMV 2018, 18. Januar 2018

## Abstract

### Informationen

<b>Titel</b>	EMV Vorprüfungen in wenigen Sekunden		
<b>Referent</b>	Dr. Christoph Zysset		
<b>Referenten Email</b>	Christoph.zysset@ccontrols.ch		
<b>Firma</b>	Computer Controls AG		
<b>Sprache des Vortrags</b>	Deutsch		
<b>Zielpublikum</b> (bitte markieren)	<input checked="" type="radio"/> Entscheidungsträger	<input checked="" type="radio"/> Entwickler	<input checked="" type="radio"/> Produktmanager
<b>Kategorie Referat</b> (bitte markieren)	<input type="radio"/> Grundlagen (40 Min.) <input checked="" type="radio"/> Erfahrung/Praxis (20 Min.)	<input type="radio"/> Normung (40 Min.) → <b>Lösungspräsentation</b>	→ <b>Know-how-Transfer</b>

### Beschreibung

Während der Entwicklung von neuen elektronischen Designs wird der Überprüfung auf elektromagnetische Verträglichkeit oft nur wenig Beachtung geschenkt und wird dann während der Zertifizierungsphase zu einem kritischen und kostspieligen Punkt. Dies liegt u.a. daran, dass Gänge in eine EMV Kammer teuer und zeitaufwändig sind und daher in den frühen Stadien der Entwicklung eines Designs nicht angezeigt sind.

Dieser Vortrag zeigt eine alternative Lösung, EMxpert von EMSCAN, auf, mit der EMV Vorprüfungen und Fehlersuche in wenigen Sekunden direkt am Entwicklungsplatz durchgeführt werden können. Damit können Kosten eingespart und das Produkt schneller auf den Markt gebracht werden.

### Zur Person

2003 – 2008: Studium Informationstechnologie und Elektrotechnik an der ETH mit Schwerpunkt auf Mikro- und Optoelektronik.

2008 – 2013: Dissertation am Institut für Elektronik (ETH) im Bereich mechanisch flexible Dünnschichttransistoren und deren Anwendung in Wearables.

2014 – 2016: Applikationsingenieur für Test- und Messtechnik bei Computer Controls Seit 2017: Application Manager bei Computer Controls